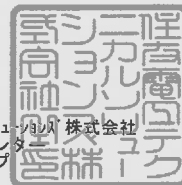
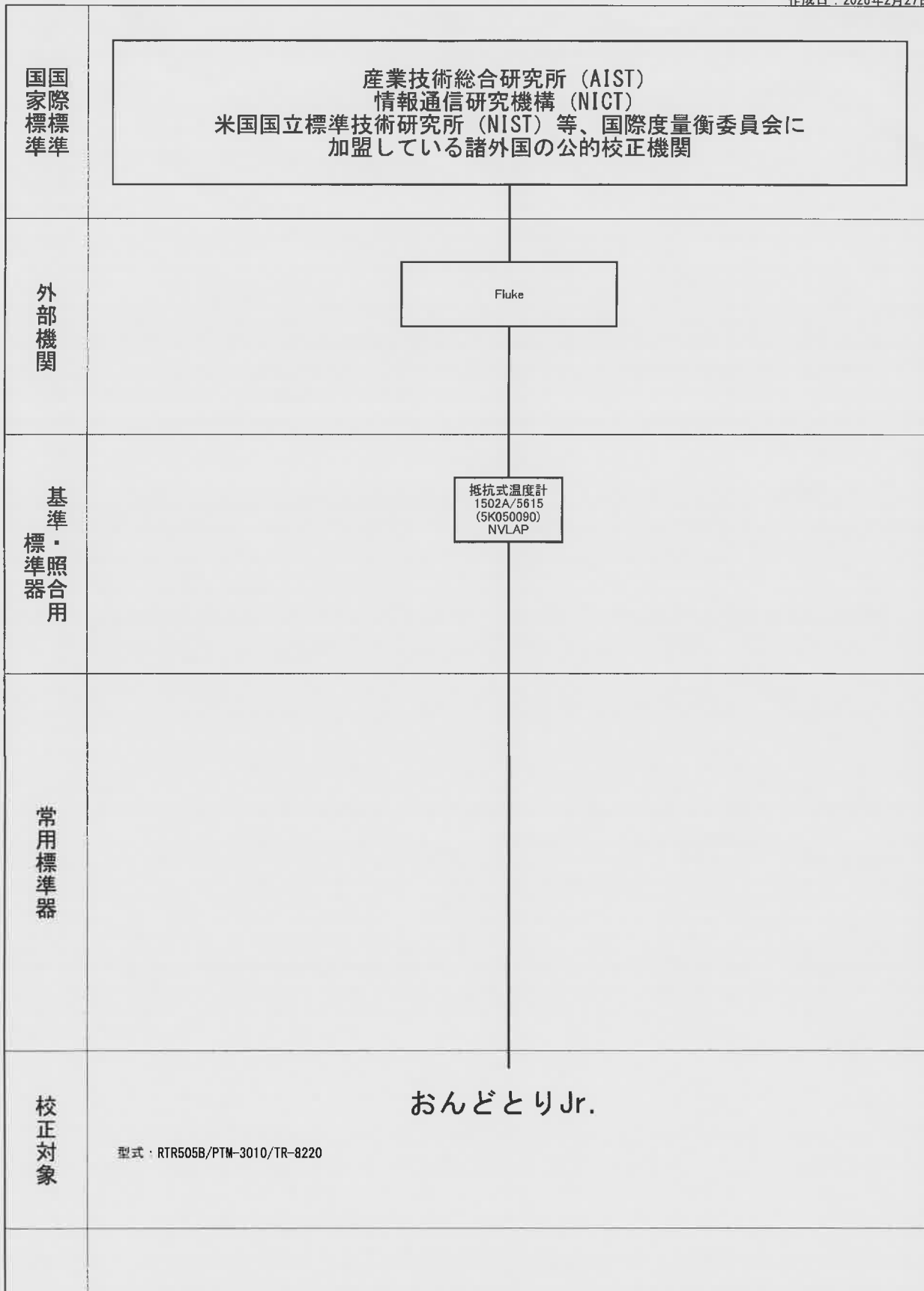


トレーサビリティ体系図

住友電気工業株式会社
横浜分析計測センター
横浜計測グループ



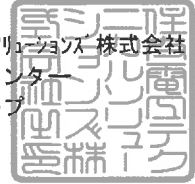
管理番号：T5H07N250274
作成日：2026年2月27日



試験成績書

発行番号： S52518028

住友電気工業株式会社
横浜分析計測センター
横浜計測グループ



顧客先 広島大学病院 殿

顧客先管理番号 -----

品名： おんどとり Jr.
メーカー： ティアンドデイ
型式： RTR505B/PTM-3010/TR-8220
製造番号： 52C33174/08104BF4/7668522

校正日： 2026年2月27日
温度： 23 °C
判定： 合格
調整： 無

校正者： 成田 麻夏
湿度： 43 %
弊社管理番号： H074286

承認者

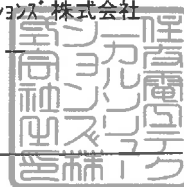
上記製品は、弊社の作業標準に従って校正が行われたことを証明します。
校正作業に使用した標準器は、日本電気計器検定所、日本品質保証機構などの公的校正機関
またはNIST (National Institute of Standards and Technology) などの国際度量衡委員会に
加盟している諸外国の公的校正機関にトレーサビリティがとれています。

【使用標準器】

品名	メーカー	管理番号
型式	製造番号	有効期限
抵抗式温度計	HART SCIENTIFIC	5K050090
1502A/5615	A15441/833504	2026/06/30

校正日：2026年2月27日
型式：RTR505B/PTM-3010/TR-8220
製造番号：52C33174/08104BF4/7668522

発行番号：S52518028
住友電工テクノロジー株式会社
横浜分析計測センター
横浜計測グループ



1. 機能点検

点検結果 良

2. 温度指示校正

確度：本体：±(0.3°C+読み値の0.3%) [at 入力モジュール環境温度：10~40°C]
±(0.5°C+読み値の0.3%) [at 入力モジュール環境温度：-40~10°C, 40~80°C]

センサ：±(0.15+0.002×|t|)°C t=試験点

測定条件：入力モジュール環境温度：10~40°Cにて

試験点	基準範囲	指示値	判定
-80 °C	-80.8 °C ~ -79.2 °C	-80.0 °C	良

Traceability System Chart

Sumitomo Electric Technical Solutions, Inc.
 Yokohama Measurement Center
 Yokohama Measurement Group

Reference No : T5H07N250277
 Created Date : 27-Feb-26

National Standard or International Standard	National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST) National Institute of Information and Communications Technology (NICT) The National Institute of Standards and Technology (NIST) and other public calibration agencies	
External Organizations	Fluke	
Reference Standards	Digital Thermometer 1502A/5615 (5K050090) NVLAP	
Working Standards		
Unit Under Test	Thermo Recorder Model No: RTR505B/PTM-3010/TR-8220	

Calibrated Date : 27-Feb-26
Model No : RTR505B/PTM-3010/TR-8220
Serial No : 52C33174/08104BF4/7668522

Reference No : S52518029
Sumitomo Electric Technical Solutions, Inc.
Yokohama Analysis and Measurement Center
Yokohama Measurement Group

1. Functional Check

Results Pass

2. Temperature Instructions Test

Accuracy

Base : $\pm(0.3^{\circ}\text{C} + 0.3\% \text{ of rdg.})$ [at Input module ambient temperature : 10~40°C]

$\pm(0.5^{\circ}\text{C} + 0.3\% \text{ of rdg.})$ [at Input module ambient temperature : -40~10°C, 40~80°C]

Sensor : $\pm(0.15^{\circ}\text{C} + 0.002 \times |t|)^{\circ}\text{C}$ t=Test point

Measuring conditions : Input module ambient temperature : 10~40°C

Test point	Limits	Indicated value	Status
-80 °C	-80.8 °C ~ -79.2 °C	-80.0 °C	Pass